# 表面粗糙度的分形特征及其对微通道 内层流流动的影响\*

## 张程宾 陈永平\* 施明恒 付盼盼 吴嘉峰

(东南大学能源与环境学院,南京 210096) (2009年1月21日收到 2009年2月8日收到修改稿)

基于分形几何学,研究了表面粗糙度的分形特征.采用 Weierstrass- Mandelbrot 函数对多尺度自仿射的表面粗糙 度进行了描述,建立了微通道内层流流动的三维模型并对表面粗糙度的影响进行了数值模拟,分析了雷诺数、相对 粗糙度和分形维数对流动阻力特性的影响.研究结果表明,与常规尺度通道不同,粗糙微通道的 Poiseuille 数不再是 常数,而是随雷诺数近似线性增加,相对粗糙度越大,流动产生的回流和分离所导致的流动压降越明显.在相同的 相对粗糙度下,粗糙表面的分形维数越大,表面轮廓变化就越频繁,这也将导致流动阻力的明显增加.并且根据文 献中的实验数据验证了本文模型的准确性.

关键词:粗糙度,层流阻力系数,微通道,分形 PACC:4710,4715,4752

## 1.前 言

在经典流体力学中,通常不需要考虑通道表面 粗糙度对于层流流动的影响.然而,随着 MEMS 器件 的迅速发展,通道尺寸越来越小,表面相对粗糙度急 剧增加,粗糙度对微通道层流流动是否有影响的问题日益受到人们的重视<sup>11</sup>.

近年来 尽管在微尺度流动和传热研究领域已 经开展了大量的工作<sup>[2-6]</sup>,但是所得到的微尺度对 传热传质影响的结论还很不一致,实验数据之间存 在着很大的差异.虽然这些差异在一定程度上可能 是由于测量误差所造成的,但是通道表面状况,特别 是通道粗糙度的不同则更有可能是导致此类偏差产 生的主要原因<sup>[1]</sup>.对于小通道(200  $\mu$ m  $\leq d_h \leq 3$  mm) 和微通道(10  $\mu$ m  $\leq d_h \leq 200 \mu$ m)<sup>71</sup>,其表面粗糙度高 度与水力直径的比值(相对粗糙度)远大于常规尺度 通道.因此可以预测,微尺度下,粗糙表面的形状和 相对粗糙度大小将会对流动特性产生重要的影响.

Pfund 等<sup>[8]</sup>实验测量了深度在 128—521 µm 之间的矩形微通道中层流阻力系数,得到的测量数据 与经典理论值存在很大差别.Hu 等<sup>[9]</sup>对带有矩形棱 状粗糙度的微通道内层流流动进行了三维数值模 拟,研究了粗糙度高度、大小、间距以及通道高度对 速度分布和压降的影响.Croce 和 Agaro<sup>101</sup>采用一系 列随机产生的波峰在理想光滑表面上模拟构建了粗 糙表面 数值研究了粗糙度对传热和流动压降的影 响.Kleinstreuer 和 Koo<sup>111</sup>通过多孔介质模型模拟了 粗糙边界,研究了低雷诺数下微通道内流体的层流 流动.Bahrami等<sup>[12]</sup>假定粗糙度曲线服从高斯分布, 建立了微通道内充分发展层流流动的理论分析模 型.Taylor 等<sup>[13]</sup>则对现有的表面粗糙度和结构纹理 对流体流动影响的研究进行了综述讨论,展望了能 用以研究粗糙度影响的主要方法.上述这些研究均 显示了微尺度下表面粗糙度对流动特性具有重要的 影响,但是都未能深入揭示其影响的机制和内在 规律.

为了研究粗糙度对微通道中流动的影响规律, 首先要有一种能精确描述粗糙表面轮廓的几何方 法<sup>[13,14]</sup>.表面粗糙凹凸分布是一个特殊的非稳态随 机过程,且随着仪器测量精度的不同或者取样尺度 的不同,测量得到的粗糙度都将发生变化<sup>[15]</sup>.尽管 在现有的粗糙度对层流流动的影响研究中已建立了 随机波峰<sup>[10]</sup>、多孔介质模拟<sup>[11]</sup>、高斯分布<sup>[12]</sup>等描述

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号:50806012), 江苏省自然科学基金(批准号: BK2008309)和航空科学基金(批准号: 2008ZH69001)资助的课题.

<sup>†</sup> 通讯联系人. E-mail:ypchen@seu.edu.cn

表面粗糙度的模型,但是这些模型都是建立在统计 平均的基础上,无法准确反映多尺度、自仿射粗糙表 面真正的几何特征.

受分形几何成功应用于研究固体表面间摩擦过 程的启发<sup>[16-18]</sup>本文将分形几何引入到微通道流动 的研究之中,探讨了粗糙表面的分形特征,研究了粗 糙度对微通道中层流流动的影响.

## 2. 粗糙表面的分形特征

分形几何学是由 Mandelbrof<sup>19]</sup>所创建,通过分

形维数来对复杂多变的非规则结构进行描述.传统 欧氏几何则主要用于描述规则结构,比如点、线、面 和立方体,其维数分别为整数0,1,2,3.而分形几何 学认为复杂的不规则结构<sup>[20-23]</sup>,如海岸线、分形树、 多孔介质和粗糙表面的几何维数并不一定是整数.

已有的研究表明,表面粗糙度轮廓表现出具有 多尺度、自仿射的特性<sup>16-18]</sup>,如图1所示,曲线经局 部放大后,其几何特征与曲线整体非常相似.

对于具有多尺度、自仿射特性的粗糙表面,从纳 米尺度到毫米尺度的表面粗糙度的轮廓 R(y)可由 Weierstrass-Mandelbrot (W-M)函数进行表征<sup>[18]</sup>,



图1 表面粗糙度轮廓曲线

$$R(y) = G^{(D-1)} \sum_{n=n_1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi\gamma^n y)}{\gamma^{(2-D)n}}$$

 $(1 < D < 2, \gamma > 1),$  (1) 式中,*G*是常数,*D*是自仿射分形维数,*G*和*D*皆独 立于仪器精度和测量尺度.对于粗糙表面, $\gamma =$  $1.5^{[18]}$ ,参数  $n_1$ 则用来描述 W-M 函数下限截止频 率,其值可由关系  $\gamma^{n_1} = 1/L_s$ 所给出, $L_s$ 则是测量 样本长度.

Weierstrass-Mandelbrot 函数 *R*(*y*)是一个多尺度 函数 其功率谱密度为

$$s(\omega) = \frac{G^{\chi_{D-1}}}{2\ln\gamma} \frac{1}{\omega^{(5-2D)}},$$
 (2)

结构函数 Sta(τ)为

State 
$$\tau$$
 ) = (  $R(y + \tau) - R(y)$ )<sup>2</sup>  
=  $\int_{-\infty}^{\infty} s(\omega) e^{i\omega\tau} - 1 d\omega$   
=  $\psi G^{\chi D-1} \tau^{(4-2D)}$ , (3)

式中,*↓* 为常数

$$\psi = \frac{I(2D-3)\sin((2D-3)\pi/2)}{2\ln\gamma(2-D)}.$$
 (4)

均方根粗糙度则为

$$\sigma = R^{2 \ 0.5} = \left[ \int_{\omega_{1}}^{\omega_{h}} \mathscr{K} \ \omega \ \mathrm{d}\omega \right]^{0.5}$$
$$= \left[ \frac{G^{(D-1)}}{2\ln\gamma} \frac{1}{4 - 2D} \left( \frac{1}{\omega_{1}^{(4-2D)}} - \frac{1}{\omega_{h}^{(4-2D)}} \right) \right]^{0.5} \ \mathscr{K} \ 5 \ \mathrm{d}\omega$$

式中, $\tau$ 为尺度,下限截止频率 $\omega_1$ 与样本长度 $L_s$ 相关, $\omega_1 = 1/L_s$ ,上限截止频率 $\omega_h$ 则由测量仪器精度 $L_r$ 决定, $\omega_h = 1/L_r$ .

粗糙表面是否具有分形特性既可通过功率谱密 度判断其是否满足方程(2)来确定,也可计算它的结 构函数来看它是否满足方程(3)<sup>241</sup>.一般情况下,粗 糙表面都具有多尺度、自仿射的特性,因此表面粗糙 度轮廓曲线是可由 W-M 函数表征的分形曲线.

对于给定的一个真实表面形貌,确定了其自仿 射分形维数 D 后, C 可通过将仪器测量得到的均方 根粗糙度 c 代入方程(5)而获得.此时,基于方程(1) 即可对粗糙表面进行更为准确的描述.

为了更进一步理解自仿射分形粗糙度的特性, 图 2 给出了利用 W-M 函数构建的具有不同分形维 数但粗糙度统计高度相同的表面轮廓曲线.由图 2 可见 尽管粗糙度统计高度相同,但是随着分形维数 的变化 粗糙度曲线明显不同.分形维数 D 越大,曲 线的不规则度就越突出,变化也越频繁.因此,分形 维数 D 可以直观地表示出表面轮廓的不规则性.同 时,也表明了 D 和 $_{\sigma}$  是一对各自独立的参数.

本文对 Pfund 等<sup>[8]</sup>实验中所用微通道的表面粗 糙特性进行了计算,其通道表面轮廓如图 3 所示.



图 2 W-M 函数构建的表面轮廓曲线  $\sigma = 2 \mu m.$  (a)D = 1.8, (b)D = 1.5 (c)D = 1.2



图 3 通道顶板和底板的表面粗糙度高度轮廓图<sup>[8]</sup> (a)顶板, (b) 较光滑底板,(c) 粗糙底板



图 4 结构函数 Su( τ )随尺度 τ 的变化 ( a )顶板 ,( b )较光滑底 板 ,( c )粗糙底板

图 4 基于结构函数方法对粗糙度自仿射分形维 数进行了计算,给出了各通道表面的分形维数.由对 数图可见,结构函数与尺度的对数值很好地满足了 线性关系,表明表面粗糙度结构函数与尺度之间符 合幂律.也就是说,方程(3)得到了很好的满足,这就 验证了通道表面粗糙度具有分形特征,可通过方程 (1)进行描述.

#### 3.1. 数学模型

为分析粗糙度对微尺度层流流动的影响 本文以 矩形窄缝微通道为例 对其间的层流流动特性进行了 研究.如图 5 所示 流体在宽 W、深 H 和长为 L 的矩 形微通道内发生层流流动.为简化计算,假定通道上 下表面为粗糙面,且只考虑粗糙度沿 y 方向的变化, 侧面则为光滑面.粗糙表面轮廓曲线由函数 R(y) ((1)式)进行构建.表面实际粗糙情况可通过函数 R(y)中不同的参数 D 和 G 进行控制,这将使建立的 流动模型具有通用性.

在建立流体层流流动模型时,作如下假设:1)稳态层流 2)常物性 3)忽略重力影响.



图 5 矩形粗糙微通道示意图

研究表明 "Navier-Stokes 方程对于微通道中的层 流流动仍然有效<sup>[56]</sup>.因此 ,由 W-M 函数所描述的粗 糙微通道中层流流动的动量方程和连续方程仍可表 示为

$$d(\mathbf{V} \cdot \nabla \mathbf{V}) = -\nabla P + \mu \nabla^2 \cdot \mathbf{V}, \quad (6)$$
$$\nabla \cdot \mathbf{V} = 0, \quad (7)$$

式中, *P*为流体压力,  $\rho$ 为流体密度,  $\mu$ 为流体粘度, *V*为速度矢量.

通道入口处流体的速度边界条件为

$$y = L \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$
,  $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$ ,  $\frac{\partial w}{\partial y} = 0$ . (9)

根据无滑移条件 ,通道表面上的速度满足

$$V = 0 :\begin{cases} z = H - R'(y), \\ z = R(y), \\ x = 0, \\ x = W. \end{cases}$$
(10)

通常 层流流动的阻力特性可用 Poiseuille 数 Po 进行表述 ,该参数等于阻力系数 f 与雷诺数 Re 的乘积

$$Po = \overline{f \cdot Re} = \frac{1}{L - L_e} \int_{L_e}^{L} f(y) \operatorname{Re}(y) dy , (11)$$

式中  $L_{e}$  为入口段长度 ,由 Schmidt 和 Zeldin<sup>[25]</sup>提出 的入口段长度计算公式  $L_{e}/d_{h} = 0.08Re + 0.7$  来确 定 ,其中  $d_{h}$  为水力直径.

在本文中相对粗糙度  $\varepsilon$  定义为均方根粗糙度  $\sigma$  与水力直径  $d_h$  的比值 ,即  $\varepsilon = \sigma/d_h$ .

#### 3.2. 数值计算

应用六面体网格对图 5 所示的微通道进行网格 划分.为考虑流体流动的入口效应和边界层效应,在 沿通道流动方向和通道截面上采用非均匀网格,即 在入口段和边界层进行局部网格加密.并采用不同 的网格尺寸进行了网格独立性检测,确保所得的数 值解都是网格独立的解.

采用控制容积有限差分法和 SIMPLE 算法<sup>261</sup>对 微分控制方程 (6)(7)进行数值求解.当相邻两个迭 代步之间的流体速度残差小于 10<sup>-6</sup>,且进出口流体 质量守恒时,认为迭代计算收敛.

#### 3.3. 模型验证

本文对 Pfund 等<sup>[8]</sup>所开展的微通道中的流动实

验进行了对比数值模拟.表1列出了微通道内的流动参数,对 Po 数计算值与实验值<sup>81</sup>进行了比较.如

表 1 所示, Po 数计算值与实验值符合较好.这表明本文所建立的模型是准确可靠的.

表1 微通道表面粗糙度参数和流动参数

通道截面尺寸1)	D	D	๙顶板 у̂ <sup>)</sup> /	𝔄 底板 )³)/	Ро		
	(顶板))	(底板) <sup>°)</sup>	$\mu { m m}$	$\mu$ m	数值解4)	经典解 <sup>1)</sup>	实验值1)
通道 #1( <i>H</i> =521 µm, <i>W</i> =1 cm)	1.55	1.525	0.44	0.20	24.1	22.4	$24.2 \pm 1.3$
通道 # 2( H = 263 µm ,W = 1 cm )	1.55	1.525	0.44	0.20	24.9	23.2	26.1 ± 2.3
通道 #3( <i>H</i> =257 µm, <i>W</i> =1 cm)	1.55	1.330	0.44	2.16	27.0	23.2	29.0±2.4

注:1 源于文献 8 数据 2)由图4计算而得数据 3)由图3计算而得数据,4)数值计算解,其对应 Re 取实验中层流段 Re 的中间值,即通道 #1,#2和 #3的 Re 分别取 1300,1000 和 1100.

## 4. 表面粗糙度对层流流动的影响

在粗糙微通道内层流流动,由于受到表面粗糙 度的影响,流向发生了变化,这将影响流体流动的沿 程压降.图6给出了水在光滑微通道和粗糙微通道 (ε=1%,D=1.8)中的沿程压降比较.由图6可知, 粗糙通道的沿程总压降大于光滑通道的沿程总压 降;在入口段之后,光滑通道的沿程压降线性增加, 但粗糙通道的沿程压降则呈波动式增加.



图 6 光滑通道和粗糙通道中的沿程压降比较 W = 1 mm, H = 100 µm, L = 0.02 m, Re = 1500.(a)总图(b)粗糙通道中沿程压降 [段局部放大图(c)光滑通道中沿程压降][段局部放大图

图 7 给出了不同宽深比的矩形微通道中, Poiseuille 数随雷诺数的变化.不同于传统通道,随着 雷诺数的变化 粗糙微通道的 Poiseuille 数不再是常数,而与雷诺数呈近似线性增加的关系,且其值要大于经典值.此现象表明,在粗糙微通道内,随着雷诺数的增加,粗糙度所导致的漩涡越来越剧烈.换言之,在低雷诺数下粗糙度引起的漩涡影响.因此,低雷诺数下的 Poiseuille 数仅略高于经典值,但随着雷诺数的增加,则越来越偏离于经典值.







图 8 相对粗糙度  $\epsilon$  对 Po 的影响 D = 1.8, Re = 1500

58 卷

图 8 则揭示了相对粗糙度 ε 对 Po 数的影响.如 图 8 所示,在相同的分形维数下,Poiseuille 数几乎与 ε 呈线性增加的关系.流体流过粗糙表面所产生的 回流和分离现象导致了流体局部流动阻力的产生. 随着相对粗糙度的增大,通道壁面附近流体的回流 和分离对流动压降的影响愈加明显.



图 9 分形维数 D 对 Po 的影响  $\varepsilon = 1\%$  , Re = 1500

此外,如图9所示,即使在相同相对粗糙度的情况下,*Po*数也与粗糙度分布的不规则性密切相关. 分形维数越大,表面轮廓分布就越不规则,流体受到 通道边界的扰动则愈频繁,这也将导致压降的明显 增加. 因此,我们可以推断,粗糙微通道内充分发展层 流流动的 Po 数不再保持常量,而是关于雷诺数、相 对粗糙度和自仿射分形维数的函数.

## 5.结 论

本 文 基 于 分 形 几 何 学,采 用 Weierstrass-Mandelbrot 函数对多尺度自仿射的表面粗糙度进行 了表征,建立了微通道层流流动的三维模型并进行了 数值模拟.研究了雷诺数、相对粗糙度和自仿射分形 维数对层流阻力特性的影响.另外,模型的准确性还 与文献[8]中的实验数据进行了对比验证.研究发现:

1 )粗糙表面可用分形几何进行描述,自仿射分 形维数直接反映了表面轮廓的不规则度,对于两个 具有相同统计粗糙度的轮廓,可能存在不同的分形 维数.

2)与传统大管不同,粗糙微通道的 Po 数不再 与雷诺数无关,而是与雷诺数呈近似线性增加的关 系,且其值要大于经典值.粗糙度产生的漩涡对流动 的影响随雷诺数的增加越来越突出.

3)随着相对粗糙度的增加,流体流过粗糙表面 产生的回流和分离对流动压降的影响也愈加明显.

4)自仿射分形维数越大,表面轮廓的不规则度 则愈烈,这也将导致压降的明显增加.

- [1] Kandlikar S G 2008 Nanosc. Microsc. Thermophys. Eng. 12 61
- [2] Li Z X , Du D X , Guo Z Y 2003 Nanosc. Microsc. Thermophys. Eng. 7 25
- [3] Li Z, Tao W Q, He Y L 2006 Int. J. Therm. Sci. 45 1140
- [4] Ren M X, Li B S, Yang C, Fu H Z 2008 Acta Phys. Sin. 57 5063
   (in Chinese)[任明星、李邦盛、杨 闯、傅恒志 2008 物理学报 57 5063]
- [5] Qu W L, Mala G M, Li D Q 2000 Int. J. Heat Mass Tran. 43 3925
- [6] Wang G D , Hao L , Cheng P 2009 Int . J. Heat Mass Tran . 52 1070
- [7] Kandlikar S G , Grande W J 2003 Heat Tran . Eng . 24 3
- [8] Pfund D, Rector D, Shekarriz A 2000 AIChE J. 46 1496
- [9] Hu Y D , Werner C , Li D Q 2003 J. Fluid . Eng. 125 871
- [ 10 ] Croce G , Agaro P D 2004 Superlattice . Microst . 35 601
- [11] Kleinstreuer C , Koo J 2004 J. Fluid. Eng. 126 1
- [12] Bahrami M , Yovanovich M M , Culham J R 2006 J. Fluid. Eng. 128 632
- [13] Taylor J B , Carrano A L , Kandlikar S G 2006 Int. J. Therm. Sci. 45 962

- [14] Kandlikar S G , Schmitt D , Carrano A L , Taylor J B 2005 Phys. Fluids 17 1
- [15] Sayles R S , Thomas T R 1978 Nature 271 431
- [16] Majumdar A, Bhushan B 1991 J. Tribol. 113 1
- [17] Majumdar A, Bhushan B 1990 J. Tribol. 112 205
- [18] Majumdar A , Tien C L 1990 Wear 136 313
- [ 19 ] Mandelbrot B B 1983 The Fractal Geometry of Nature (New York : Freeman)
- [20] Li T, Shang P J 2007 Acta Phys. Sin. 56 4393 (in Chinese) [李 形、商朋见 2007 物理学报 56 4393]
- [21] Qiao L F, Zhang Y M, Xie Q Y, Fang J, Wang J J 2007 Acta Phys. Sin. 56 6736 (in Chinese)[乔利锋、张永明、谢启源、方 俊、王进军 2007 物理学报 56 6736]
- [22] Chen Y P, Cheng P 2002 Int. J. Heat Mass Tran. 45 2643
- [23] Yu B M 2008 Appl. Mech. Rev. 61 050801
- [24] Majumdar A, Tien C L 1991 J. Heat Transfer 113 516
- [25] Schmidt F W , Zeldin B 1969 AIChE J. 15 612
- [26] Patankar S V 1980 Numerical Heat Transfer and Fluid Flow (Washington DC: Hemisphere)

## Fractal characteristics of surface roughness and its effect on laminar flow in microchannels \*

Zhang Cheng-Bin Chen Yong-Ping<sup>†</sup> Shi Ming-Heng Fu Pan-Pan Wu Jia-Feng

( School of Energy and Environment , Southeast University , Nanjing 210096 , China )

(Received 21 January 2009; revised manuscript received 8 February 2009)

#### Abstract

The fractal characteristics of the surface roughness are investigated by using fractal geometry. A three-dimensional model of laminar flow in microchannels with surface roughness characterized by fractal geometry is developed and analyzed numerically. The Weierstrass-Mandelbrot function is introduced to characterize the multiscale self-affine roughness. The effects of Reynolds number Re, relative roughness, and fractal dimension on Poiseuille number are investigated and discussed. The results show that, different from the conventional channels, Poiseuille number in rough microchannels is no longer constant for different Re, but increases approximately linearly with Re, and is larger than the classical value. The flow over roughness features with high relative roughness induces recirculation and flow separation, which plays an important role in flow pressure drop. More specifically, roughness with larger fractal dimension, which yields more frequent variation in the surface profile, also results in a significant increase in pressure loss, even though at the same relative roughness. In addition, the accuracy of Poiseuille number calculated by the present model is verified by the experimental data available in the literature.

Keywords : roughness , friction factor of laminar flow , microchannel , fractal PACC : 4710 A715 A752

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50806012), the Natural Science Foundation of Jiangsu Province, China (Grant No. BK2008309), and the Aeronautical Science Foundation, China (Grant No. 2008ZH69001).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail:ypchen@seu.edu.cn